





SEM in DMA (L-314)





[NTF](#) > [TOI](#) > [O nas](#) > [Prostori](#) > [SEM in DMA \(L-314\)](#)

 prostoru se nahajata dva aparata:

 **Dostop (scanning) elektronski mikroskop SEM JSM-6060 LV (Jeol, Japonska)**

-  **Amični mehanski analizator DMA Q800 (TA Instruments, ZDA)**

•  SEM aparat je namenjen študiju površine, morfologije in topografije površin ter velikosti delcev. Aparat
•  deluje tudi napraševalnik preparatov z zlatom v primeru neprevodnih materialov. Več o aparatu najdete
•  [tukaj](#).

•  **DMA aparat je namenjen merjenju viskoelastičnih lastnosti raznovrstnih materialov (merjenje Tg in sekundarnih
•  prehodov, vpliv frekvence na module in Tg, vpliv polnil, dodatkov in adhezivov, vpliv tehnoloških procesov,
•  stabilnost dimenzij, lezenje, relaksacije napetosti, termomehanika, napoved obnašanja materiala v širokem
•  frekvenčnem in časovnem območju). Več o aparatu najdete [tukaj](#).**

- 



 [to content](#)

- 